

Title (en)

METHOD FOR DETECTION OF A DEFECT IN A LISTENING INSTRUMENT

Title (de)

VERFAHREN ZUM ERKENNEN EINES DEFEKTES IN EINEM HÖRINSTRUMENT

Title (fr)

PROCÉDÉ DE RECONNAISSANCE D'UN DÉFAUT DANS UN APPAREIL AUDITIF

Publication

EP 3454572 A1 20190313 (DE)

Application

EP 18188624 A 20180813

Priority

DE 102017215825 A 20170907

Abstract (en)

[origin: US2019075403A1] A method for detecting a defect in a hearing instrument that has at least one first input transducer and at least one output transducer. A first transfer function of a first acoustic system, which includes the output transducer and the first input transducer, is determined, and at least a first reference function for the first transfer function is determined. The first transfer function is compared with the first reference function and a defect in the hearing instrument is detected based on the comparison. A hearing instrument with an input transducer and an output transducer is set up to carry out the method.

Abstract (de)

Die Erfindung nennt ein Verfahren zum Erkennen eines Defektes in einem Hörinstrument (1), welches wenigstens einen ersten Eingangswandler (4) und wenigstens einen Ausgangswandler (8) aufweist, wobei eine erste Transferfunktion (T1) eines ersten akustischen Systems (26), welches den Ausgangswandler (8) und den ersten Eingangswandler (4) umfasst, ermittelt wird, wobei wenigstens eine erste Referenzfunktion (R1) für die erste Transferfunktion (T1) bestimmt wird, wobei die erste Transferfunktion (T1) mit der ersten Referenzfunktion (R1) verglichen wird, und wobei anhand des Vergleichs ein Defekt im Hörinstrument (1) erkannt wird. Die Erfindung nennt zudem ein Hörinstrument (1) mit wenigstens einem ersten Eingangswandler (4) und einem Ausgangswandler (8), welches zur Durchführung des Verfahrens eingerichtet ist.

IPC 8 full level

H04R 25/00 (2006.01)

CPC (source: CN EP US)

H04R 25/30 (2013.01 - US); **H04R 25/305** (2013.01 - EP US); **H04R 29/001** (2013.01 - CN); **H04R 25/405** (2013.01 - EP US);
H04R 25/505 (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [XAYI] US 2003007647 A1 20030109 - NIELSEN KIM HJORTGAARD [DK], et al
- [XP] WO 2018129242 A1 20180712 - KNOWLES ELECTRONICS LLC [US]
- [Y] US 2005259829 A1 20051124 - VAN DEN HEUVEL KOEN [BE], et al
- [XY] EP 1467595 A2 20041013 - GENNUM CORP [CA]
- [A] US 2017070826 A1 20170309 - PEDERSEN MICHAEL SYSKIND [DK], et al

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME

DOCDB simple family (publication)

DE 102017215825 B3 20181031; CN 109474877 A 20190315; CN 109474877 B 20210817; DK 3454572 T3 20210809;
EP 3454572 A1 20190313; EP 3454572 B1 20210519; US 10462581 B2 20191029; US 2019075403 A1 20190307

DOCDB simple family (application)

DE 102017215825 A 20170907; CN 201811030171 A 20180905; DK 18188624 T 20180813; EP 18188624 A 20180813;
US 201816124408 A 20180907